

Physikalisches Praktikum



E24 Halbleiterdioden	with a selection of the selection of the comment of the
Name: Maxim Gilsendegen	Matrikelnummer: 3650672
Fachrichtung: Chemie O.Sc.	Versuchsdatum: 28.03.20 23
Mitarbeiter/in: David Flemming	Gruppennummer: C-004
Assistent/in: Pascal Schmielt	Endtestat:

Dieser Fragebogen muss von jedem Teilnehmer eigenständig (keine Gruppenlösung!) handschriftlich beantwortet und vor Beginn des Versuchs abgegeben werden. Die Vorbereitung wird zusätzlich durch einen Test bzw. eine mündliche Prüfung über die physikalischen Grundlagen des Versuchs kontrolliert. (Version: 16. Oktober 2021)

Versuchsziel und Versuchsmethode:

Bestimmung der Kenntinien von Silizium- und Germanium-Dioden Oszillackopbild für die lenerdiade erstellen. Kenntinien für die UDs nie für die Zenerdiade Schreiben und dun Zusammenhang zwischen Spannungsschwelle und Wellenlänge des Lihts.

1.) Zeichnen Sie das Bändermodell eines Metalles, Halbleiters und Isolators. Tragen Sie typische Bandabstände in eV und die Besetzung der Bänder mit Elektronen ein.

2.) Wie groß ist die mittle Zimmertemperatur und die	re thermische Energie vo e Energie von sichtbarem	on (freien) Elektronen bei Licht in eV?	1
The state of the s		1 >= 400 nm - 700 nm	
Millere: 25 meV		·	
3.) Nennen Sie drei Möglie zu verbessern. Temperatur veränderung, Elektronen augube" dur			
Elletronentugabe dur	in doblerunge in d	len Kristall.	
	annungga) ka kasay		
4.) Nennen Sie jeweils zwe		nator- und eine Akzeptor-	
Dotierung in Silizium und			
Silizium O A	Germaniam O Antimo Gallium Bismut Thallium		
	Antimor Gallium		
Phosphor Albuinian Arsen Indian	Bismut Thallium		
(2000)			
5.) Skizzieren Sie das Rau			
	# 0 0 + 0 0		
000	80 + O O /		
00 =	+ 0 0		
0 0	+ 0 D		
The state of the s			
	- n	mad society at mysts	
P Spen	rschiebt.		
		1.1. Lei steimenden	
		errrichtung bei steigender	
Temperatur? Is wind eshold, da	exp (ell) ben	ell bei größerem I leich I sein muss, mit zunehmen	
inner Wester wird	, trotadem woch go	leich I seen mass, and Eunehorens	le
Temperatur strigt in c	de Disele de Stron	tun	
1 1 D to:-btue	and an march on?	Betriebsspannung, sondern	
der maximale Betriebsstro	om angegeben:	I Bal alamana	
Show lines lines	e Howeimungen D	e: de Betriebsspanning Gweitungen bei der nober leichte Abweitung icht all zu dramatich	
P. L.	defencted 1.1	1 1 11/2 11 1	
Spanning in V Kielle	musicat phren,	nobel wient Howeithing	ez
bein	, Detriebsstrom n	icht all zu dramatich	
evsch	einen		

8.) Machen Sie sich mit den verwendeten Anordnung für Messungen mit Gleich- und Wechselstrom vertraut. Welche Funktion haben die Widerstände in beiden Schaltungen?

Die Widerstände sor gen dafür, die Spannung zu vergulieven/ konstant zu kalten. 1. Schutz der Komponenten, Teilung der Spannung 2. Schutz der CED & Transistor

9.) Erklären Sie die Funktionsweise der Wechselstromschaltung nach Abbildung E24-2, indem Sie den Stromfluss für eine positive und eine negative Halbwelle der Wechselspannung beschreiben. Warum muss am Oszilloskop invertiert werden für eine Darstellung der Kennlinie in der üblichen Form?

neg.
Span.

1 Mulbrelle

Ours Oszi Moskep muss in verlieit redes, da die Keanlinie sonst nicht in xya Verläuft.

E24: Halbleiterdiode

Gruppe: C-004

Verfasser: Maxim Gilsendegen, David Flemming

Studentische Mailaddresse: st182513@stud.uni-stuttgart.de, st182571@stud.uni-stuttgart.de

Versuchstag: 28.03.2023

Abgabedatum: 30.03.2023

Assistent: Pascal Schmidt

Inhalt

1. Versuchsziel und Versuchsmethode	6
2. Versuchsablauf	6
2.1 Germanium- und Siliciumdiode	6
2.2 Zenerdiode	6
2.3 LEDs	7
3 Formeln	7
4. Messwerte	8
4.1 Gemanium- und Siliciumdiode	8
4.2 LEDs	9
5.Auswertung	9
5.1 Germanium- und Silizium-Diode	9
5.1.1 Grafische Darstellung der Messergebnisse und ermitteln des Sperrstroms Is	9
5.1.2 Berechnung der verbesserten Leitfähigkeit unter Wärmeeinfluss	10
5.1.3Ermittlung des Sperrsättigungsstroms	11
5.2Kennlinie der Zenerdiode	12
5.3Kennlinien der LEDs	12
6. Fehler	14
7. Zusammenfassung	14
8. Quellen	14
O. Anhang	1 -

1. Versuchsziel und Versuchsmethode

Über den Versuch sollen die Haupteigenschaften von Hableiterdioden herausgearbeitet werden. Zuerst werden Silicium- und Germaniumdioden bei Gleichstrom in Stromflussrichtung sowie in Sperrrichtung betrieben. Dadurch werden dann die Durchlasskennlinien erstellt. Zudem wird die Temperaturabhänigkeiten der Dioden festgestellt. Außerdem werden die Kennlinien von Zenerdioden und LEDs mittels eines Oszilloskops bestimmt. Zusätzlich wird die minimale Spannungsschwelle der einzelnen LEDs bestimmt.

2. Versuchsablauf

2.1 Germanium- und Siliciumdiode

Zuerst wird ein Stromkreis entsprechend der Abb.1 aufgebaut, wobei der gestrichelte Teil vorerst ignoriert wird. Anschließend wird für jede Dioden Art in Durchlassrichtung die Spannung bei einem Stromstärkemessbereich von 5 μ A bis zu 8 mA gemesssen. Anschließend wird die Stromstärke auf 200 μ A erhöht und die Spannung der einzelnen Dioden wird vor und nach der Erwärmung per Finger gemessen. Anschließend wird die Polarität umgekehrt und die Speerkennlinien gemessen.

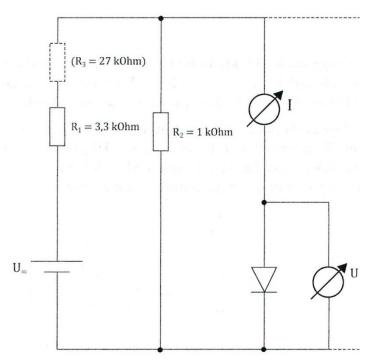


Abb.1 Schaltkreis der Silicium- und Germaniumdiode[1]

2.2 Zenerdiode

Zuerst wurde ein Stromkreis entsprechend der Abb.2 aufgebaut. Danach wurde die Kennlinie der Zenerdiode von einem Oszilloskop bei Wechselstrom gemessen.

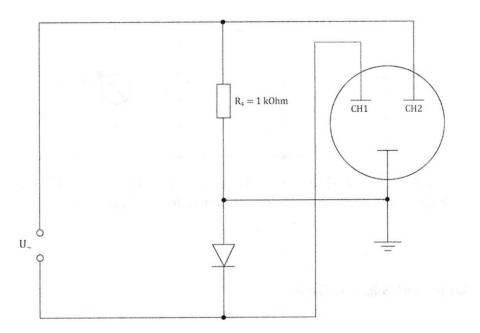


Abb.2 Schaltkreis für Zenerdiode[1]

2.3 LEDs

Der Aufbau entspricht Abb.2 . Analog zu 2.2 wurden die Kennlinien bestimmt. Anschließend wurden die Spannungschwelle der LEDs bestimmt, welche angibt wann die einzelnen LEDs leuchten.

3 Formeln

Für die Berechnung der Stromstärke *I* über die Spannung *U* und der Temperatur *T* gilt die Shockleysche Gleichung:

$$I = I_s \cdot \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right] \tag{1}$$

 I_{S} steht dabei für den Speerstrom, e für die Elementarladung und k für die Boltzmannkonstante.

Für $U \ge 0.1$ V gilt nährungsweise folgende Beziehung:

$$I = I_s \cdot \exp\left(\frac{eU}{kT}\right) \tag{2}$$

Für die Energie E eines Photons gilt:

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \tag{3}$$

Wobei h für das plancksche Wirkungsquantum steht, c für die Lichtgeschwindigkeit und λ für die Wellenlänge des Lichts.

Die elektrische Leitfähigkeit σ eines Stoffes wird über folgende Formel berechnet:

$$\sigma = \frac{l \cdot I}{A \cdot U} \tag{3}$$

wobei A die Oberfläche des Querschnitts darstellt und I die Länge des Gegenstandes darstellt.

4. Messwerte

4.1 Gemanium- und Siliciumdiode

In der nachfolgenden Tabelle sind die Spannung U und die Stromstärke I für die Germanium- und Siliciumdiode in Stromdurchlassrichtung festgehalten.

Tab.1 Messwerte für *U* und *I* beider Dioden in Durchlassrichtung

	Germaniumdiode		Siliciumdiode	
Messung	<i>U</i> (mV)	/ (μA)	<i>U</i> (mV)	/ (μA)
1	70,0	4,6	364,0	6,5
2	102,5	13,0	385,0	17,1
3	135,5	36,0	456,0	37,8
4	160,5	70,0	484,0	113,5
5	194,9	166,0	516,0	226,6
6	221,1	300,2	552,0	490,0
7	251,9	570,0	586,0	1000,0
8	296,4	1190,0	621,0	2020,0
9	328,0	2320,0	656,0	4110,0
10	361,0	4040,0	687,0	8000,0
11	409,0	7990,0	-	-

Tab.2 Die Spannung U und die Stromstärke I für die Germanium- und Siliciumdiode in Stromdurchlassrichtung festgehalten wobei die Messwerte vor und nach dem Erwärmen aufgenommen wurden

	Germaniumdiode		Siliciumdiode	
Messung	<i>U</i> (mV)	/ (μA)	<i>U</i> (mV)	/ (μA)
Vor Erwärmen	194,4	180	508,0	200
Nach Erwärmen	184,4	180	501,0	200

Nach der Umpolung ergaben sich für *U* und *I* die in Tab.3 festgehaltenen Werte in Sperrichtung.

Tab.3 Messwerte für *U* und *I* beider Dioden in Sperrichtung

	Germaniumdiode		Siliciumdiode	
Messung	<i>U</i> (mV)	/ (μA)	<i>U</i> (mV)	/ (μA)
1	529	0,6	441	0,2
2	1015	0,7	1040	0,2
3	1514	0,8	1556	0,3
4	1965	0,8	2032	0,3
5	2515	0,9	2480	0,4
6	2991	1,0	3010	0,4

7	3990	1,2	4020	0,6
8	4920	1,3	4960	0,6
9	6050	1,4	6010	0,7
10	7070	1,5	6990	0,8

4.2 LEDs

Die Spannungschwelle wurde bei $U_{\rm rot}=1,620~{\rm V}$ und für $U_{\rm blau}=2,380{\rm V}$ festgehalten.

5. Auswertung

5.1 Germanium- und Silizium-Diode

5.1.1 Grafische Darstellung der Messergebnisse und ermitteln des Sperrstroms I_s

Anhand der Abbildung 1 lässt sich ein exponentieller Zusammenhang zwischen der Spannung und der

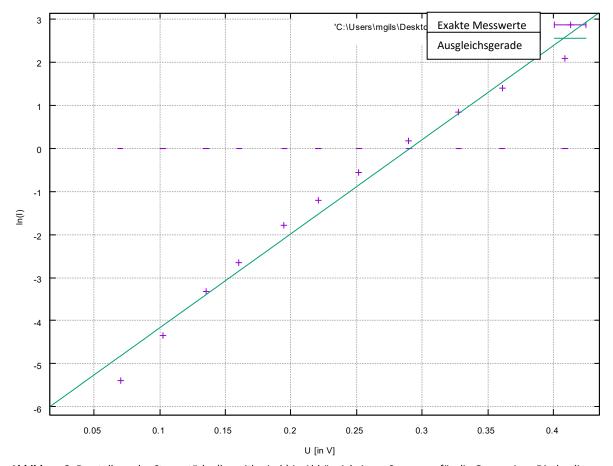


Abbildung 3. Darstellung der Stromstärke (logarithmisch) in Abhängigkeit zur Spannung für die Germanium-Diode, die genauen Messwerte werden als Kreuze dargestellt, der dargestellte Graph zeigt die Ausgleichsgerade.

Stromstärke feststellen, aus diesem Grund wird die y-Achse logarithmisch dargestellt, um einen exponentiellen Zusammenhang aufzuzeigen. Durch die Fitfunktion lässt sich der Wert für U=0 grafisch ermitteln. Dieser Beträgt hierbei $\ln(I)=-6.3515$ woraus folgt, dass der Sperrstrom $I_{\rm S}=0.0017~{\rm mA}$ ist.

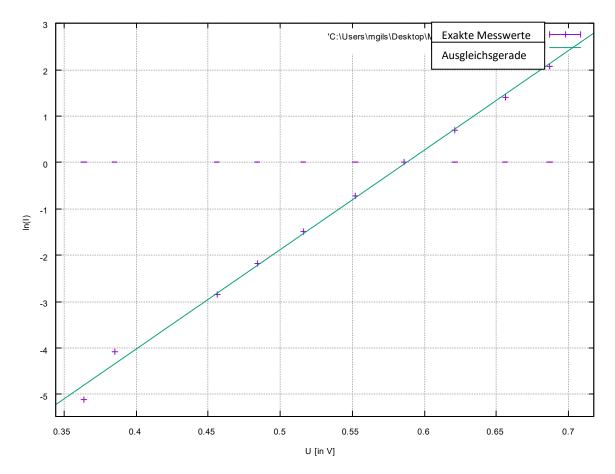


Abbildung 4. Darstellung der Stromstärke (logarithmisch) in Abhängigkeit zur Spannung für die Silizium-Diode, die genauen Messwerte werden als Kreuze dargestellt, der dargestellte Graph zeigt die Ausgleichsgerade.

Für Abbildung 2 lassen sich dieselben Feststellungen wie für Abbildung 1 treffen, für U=1 beträgt aber $I_s=e^{-12.6065}\approx 0.0000034$ mA.

5.1.2 Berechnung der verbesserten Leitfähigkeit unter Wärmeeinfluss

Mit den Werten aus [Tabelle mit Messwerten] kann die prozentuelle Veränderung der Leitfähigkeit D der Germanium- (Ge) und Silizium- (Si) Dioden berechnet werden.

$$D = \frac{U_{\text{K\"uhl}} - U_{\text{Warm}}}{U_{\text{K\"uhl}}}$$

$$D_{\text{Ge}} = \frac{U_{\text{K\"uhl}_{\text{Ge}}} - U_{\text{Warm}_{\text{Ge}}}}{U_{\text{K\"uhl}_{\text{Ge}}}} = \frac{194,4 \text{ V} - 184,8 \text{ V}}{194,4 \text{ V}} \approx 0.0494 = 4.94 \%$$

$$D_{\text{Si}} \approx 0.0138 = 1.38 \%$$

Somit kann eine Verbesserung der Leitfähigkeit bei Germanium um 4.94 % und bei Silizium um 1.38% festgestellt werden.

5.1.3Ermittlung des Sperrsättigungsstroms

Der hervorgehobene Punkt mit Koordinaten ist der Sperrsättigungsstrom $I_{\rm s}=0.5634$.

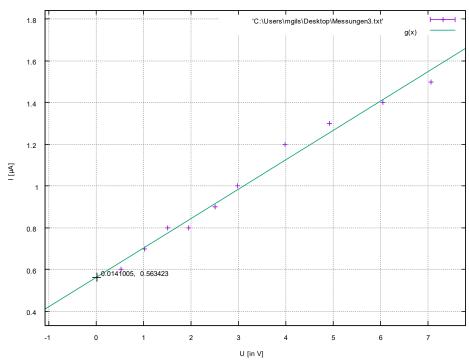


Abbildung 5. Darstellung der Stromstärke in Abhängigkeit zur Spannung für die Germanium-Diode, bei der Messung der Sperrspannung, die genauen Messwerte werden als Kreuze dargestellt, der dargestellte Graph zeigt die Ausgleichsgerade.

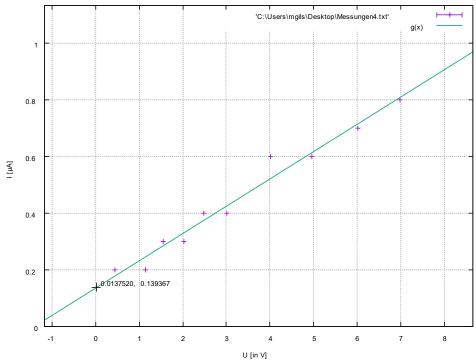


Abbildung 6. Darstellung der Stromstärke in Abhängigkeit zur Spannung für die Silizium-Diode, bei der Messung der Sperrspannung, die genauen Messwerte werden als Kreuze dargestellt, der dargestellte Graph zeigt die Ausgleichsgerade.

Der hervorgehobene Punkt mit Koordinaten ist der Sperrsättigungsstrom $I_{\rm S}=0.1394$.

5.2Kennlinie der Zenerdiode

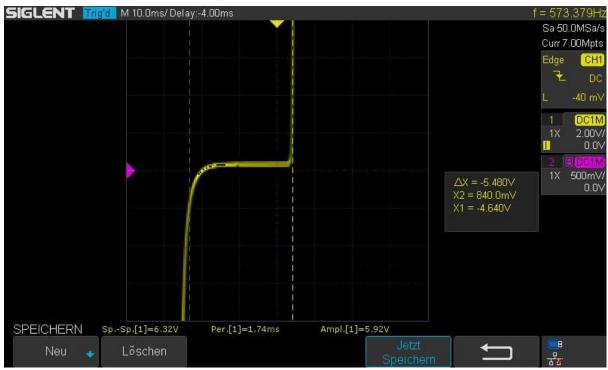


Abbildung 7. Kennlinie der Zenerdiode gezeichnet durch das Oszilloskop.

In Abbildung 7 ist die Kennlinie der Zenerdiode zu erkennen, hierbei ist zu erwähnen, dass diese nach dem Graphen in beide Richtungen den Strom durchlässt, was die Zenerdiode auch ausmacht.

5.3Kennlinien der LEDs

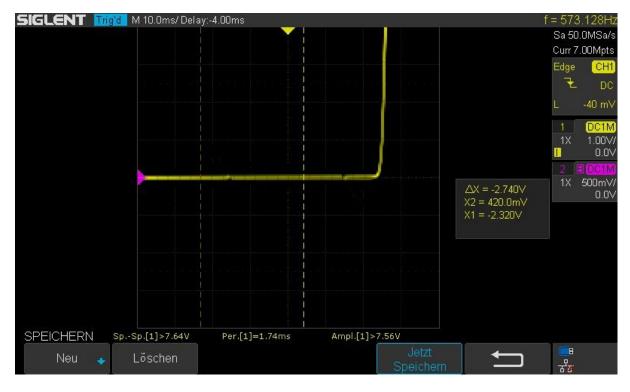


Abbildung 8. Kennlinie der blauen LED gezeichnet durch das Oszilloskop.

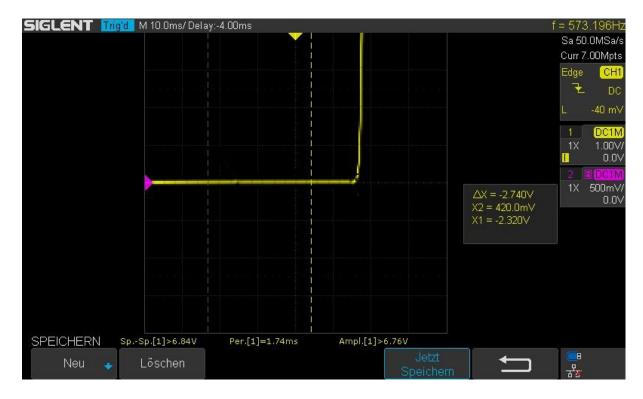


Abbildung 9. Kennlinie der roten LED gezeichnet durch das Oszilloskop.

Anhand von Abbildung 6 und 7 ist zu erkennen, dass die Kennlinie der roten LED früher, also bei geringerer Spannung, als die der blauen LED stark zunimmt. Dieser Unterschied kann auch anhand der ermittelten Werte, ab welcher Spannung die LEDs anfangen zu leuchten, beobachtet werden. $U_{\min,r}=1.620\,$ V und $U_{\min,b}=2.380\,$ V, durch diese Diskrepanz der zwei Werte lässt sich schlussfolgern, dass für kürzere Wellenlängen, also höher energetisches Licht auch größere Spannungen benötigt werden. Der Zusammenhang wird nochmal klarer, wenn man die Formel für die Energie eines Photons betrachtet.

$$E_{\rm Ph} = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Wobei h dem Plank'schen Wirkungsquantum, c der Lichtgeschwindigkeit und λ der Wellenlänge entspricht.

Da $h \cdot c$ konstant ist, kann man $E = \frac{1}{\lambda}$ betrachten, nimmt die Wellenlänge zu, wird E immer kleiner, wird die Wellenlänge jedoch kleiner, wächst E. Die Energie die als sichtbares Licht frei wird, wird für kurzwelliges Licht immer größer, weshalb zu erwarten ist, dass die Spannung, die dafür benötigt wird auch zunehmen muss.

Für blaues Licht (ca. 500nm) gilt:

Wobei

$$E_{\rm Ph} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \, \rm Js \, \cdot 3 \, \cdot 10^8 \, \frac{m}{\rm s}}{500 \, \cdot 10^{-9} \, \rm m} = 3.9756 \cdot 10^{-19} \, \rm J$$
 für rotes Licht
$$E_{\rm Ph} = 2.8397 \cdot 10^{-19} \, \rm J$$
 gilt.

6. Fehler

Bei der Arbeit mit dem Stromgerät bei Gleichstrom wurde festgestellt, dass die Messungen sehr ungenau ausfielen, da andauernde Sprünge von bis zu $\Delta I=300~\mu A$ möglich waren, wobei für die Spannung nur Sprünge von bis zu $\Delta U=0.150~V$ beobachtet wurden. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Geräte selber bereits einige Ungenauigkeiten haben und die Stromkreise nicht absolut optimal waren, sodass keine Ungenauigkeiten auftreten könnten. Die Messungenauigkeiten können in den Abbildungen 1 bis 4 gut beobachtet werden, vor allem bei geringeren Stromstärken war die Ungenauigkeit des Netzgerätes ein Problem. Durch Ausgleichsgeraden in den Grafiken, konnte jedoch jeweils der lineare Zusammenhang verdeutlicht werden. Bei der Mindestspannung für die LEDs ist auch von einem statistischen Fehler auszugehen, weil nicht ganz perfekt ermittelt werden konnte, welche Spannung genau hier benötigt wurde. Das Ablesen am Oszilloskop ist auch fehlerbelastet gewesen.

7. Zusammenfassung

Anhand von mehreren Messungen konnten für die Germanium- und Siliziumdiode der Sperrstrom und die Sperrsättigungsspannung ermittelt werden. Durch das Oszilloskop konnten die Kennlinien für die Zener- und die blaue und rote Licht-Diode gezeichnet werden. Außerdem konnten Unterschiede bei den Kennlinien von verschiedenfarbigen LEDs experimentell und rechnerisch nachgewiesen werden, vor allem wenn es um den Zusammenhang zwischen Energie des emittierten Lichts und der angesetzten Spannung geht.

8. Quellen

[1] Anleitungstext E24 Halbleiterdiode, 2021

9. Anhang

	E24-	Arberte	dide		
Messungen					
Vin Quog V 7 2	anv)	1025mV	135,	201	1605mV
In 2,99m1 / 46		13,0pt	1369	11	#0,0p1
Va 1949.11	22/1		25 1, 9m		296 gm
166 Opt	300,24	4 0	StonA	1	1, 19 ml
	0,3611				
V2 / 2, 32m1	U.OUm				
V 03641 038	- 1/1 OH	56 V/0, USU	4.10	54/1/	
In 8.65 pt 131		113,3			0,520
) Open	O, U gors
9586V 9621V		0,687			
Man 20 mg	1 UMm	A 8,00m	1		
5: 0,2 mt 1940	Si.				
Ge: 0, But 1848V	0,502				
Cae	4508				
Ge: 0529V 1,0	4614				
0,6 ml 3,0	150	1,514	v	7,965	
2,575 1 2,9	910	339 V	1	0.8µ1	
JUA OI	211	7,2 pt		13 mA	
605V 707V					

S. 0,041V 1556 1.000 2.032 O, Rest 03 02 03 4 96 2 480 3,010 4.02 0.4 0.4 0.6 0,6 8.99 6.01V 0.7 0.8 1620V - ROE 2380V - Clau λ->0 Ε->0 RZ. WL -> hohe En lan WL -> geringe E. who Te 4=0 -747)=-6.35153646